

# 簡易型走査電子顕微鏡利用手引き

(ver. 1, Oct. 2011)

## 仕様

日本電子社製 走査電子顕微鏡 JSM-6010LV

分解能：高真空モード 4.0 nm (20 kV)、低真空モード 5.0 nm (20 kV)、倍率：×8～×300,000、加速電圧：0.5 kV～20 kV、最大試料サイズ：直径 150 mm、高さ 48 mm、検出器：二次電子検出器、反射電子検出器（組成像・凹凸像・立体像）、表示画像：標準、2種ライブ像、2分割ライブ像、フレキシブルウィンドウ表示、デジタルズーム、ディアルマグコーティングなしでサンプルを観察することができます。サンプル表面の観察、組成の違い、サンプルの立体像の観察が可能です。

走査電子顕微鏡の基礎知識については、下記のメーカーサイトをご参照下さい。

[http://www.jeol.co.jp/technical/dictionary/semterms/sem-a\\_z.pdf](http://www.jeol.co.jp/technical/dictionary/semterms/sem-a_z.pdf)

## 利用の流れ

- ① 事前打ち合わせ（メールもしくは面談）
- ② 申請書の提出、審査
- ③ 採択の連絡、日程調整
- ④ 分析サンプルの持参
- ⑤ サンプルの観察、写真撮影、各種計測
- ⑥ データの納品（写真、計測データは撮影当日にお渡しします。）

## 利用する上での注意点

管理者は原則として機器の管理と予約、基本的な使用方法を説明します。実際の実験操作及びデータ解析は、原則として利用申請者自身が行います。

植物組織を固定する事無く、その表面構造や組織の組成の違いをそのまま観察することが可能です。遺伝子組換え植物個体を持ち込む際には、カルタヘナ法に基づく遺伝子組換え植物移動の手続きが必要です。事前にご相談下さい。

## 費用負担

利用条項に応じ課金します。利用者の旅費・宿泊費等（学内宿泊施設あり）は原則として利用者がご負担ください。

## Authorship

成果発表の際には、事前にご相談ください。また、Acknowledgements 等に以下の内容を記載されるようお願い致します。

(例) This research was supported by Japan Advanced Plant Science Network.

### 支援開始時期

平成 23 年 10 月下旬より支援開始の予定です。

### 連絡先

[miono@sakura.cc.tsukuba.ac.jp](mailto:miono@sakura.cc.tsukuba.ac.jp)

小野 道之 (筑波大学 遺伝子実験センター 准教授)